

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～+85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～+60℃（注2）	
	電 圧	AC 100 V	保存湿度範囲	40%～70%（注2）	
	電 流	0.5 A(信号部)（注3） 3.0A(MF端子部)	使用湿度範囲	相対湿度85%以下 (但し結露の無いこと)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 気 的 性 能	接触抵抗	100 mA（DC 又は 1000 Hz）で測定する。	信号部：90 mΩ以下 MF端子部：30 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 60.0 N以下 引抜力 6.0 N以上	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗:信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mm、 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗:信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55→+85℃ 時間 30→30 分を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2～3分)		○	—
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2℃ 75±5%RH 96 時間放置する。 (試験規格: JIS C 60068)	はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	リフローの場合: ピーク温度 MAX260℃ 220℃以上 60秒以内	外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	—
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内		○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△0					
備考			承認	HS. OKAWA	12. 01. 25
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	KI. HIROKAWA	12. 01. 25
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	TH. SANO	12. 01. 25
注3. 1端子当たりの定格電流となります。			製 図	TH. SANO	12. 01. 25
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-159563-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	FX18-100P-0.8SV	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL579-0019-8-00	△0 1/1